文章编号:1004-4213(2010)10-1780-6

基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计

郭俊,马永利,张璐,赵翠玲,王文生

(长春理工大学现代光学测试实验室,长春 130022)

摘 要:针对管道测试的需求,将梯度折射率透镜的光学性能与显微镜相结合,设计了具有大景深的管道内窥镜光学系统.在保证所需放大倍率的同时,利用梯度折射率透镜介质折射率渐变的特点,使该系统的景深增大为原来的 200 倍.该系统像面近似球面的特点使其更适合圆形管道内壁的 检测,当它与 CCD 等器件相结合,不仅实现管道内窥镜的数字化测试,而且能通过监视器在更大景 深范围内、方便的监测管道内壁的裂痕、磨损等清晰的图像.

关键词:内窥镜;梯度折射率透镜;显微镜;大景深

中图分类号:TH741 文献标识码:A

0 引言

管道内窥镜凭借其体积小、结构灵活的特点,已 经广泛应用于各种管道设备的生产、检测及日常检 测和维护中.它作为一种无损检测设备,有效延长了 人眼的视距,突破了人眼观察的死角,可以准确、清 晰地观察管道设备内部或零件内表面的情况,如磨 破损、表面裂纹等,避免了不必要的设备拆卸以及零 部件损伤,具有操作方便,检查效率高,结果客观准 确的优势,是管道设备检测的一个有力工具.

显微镜是管道内窥镜的重要组成部分.由于显 微系统的景深很小,对具有一定厚度的物体成像得 到的图像中只有部分细节良好聚焦,其他部分则是 模糊的.一般情况,当显微镜的放大倍率越大,测试 准确度越高,其景深也就越小.

大景深对成像系统而言意味着同一画面中有更 多的清晰景物,更多的可测控、监控对象.自 20 世纪 60 年代由 Welford 提出环形孔径增大景深方法以 来,又出现了很多其他的方法^[9],如二维成像序列的 图像融合、特殊设计透镜结合图像处理^[10]等.但这 些方法都需要复杂的后续处理,并非直接增大光学 系统的景深.

高质量的管道内窥镜既需要大的放大倍率,又 需要大的景深.因此,放大倍率与景深的矛盾成为制 约管道内窥镜性能的瓶颈.本文利用梯度折射率透 镜介质折射率渐变的特点,将其与显微物镜相结合, 设计了其像面弯曲近似球面、大景深的管道内窥镜, doi:10.3788/gzxb20103910.1780

其景深增大为原来系统的 200 倍.并获得了很好的 像质,能与 CCD 等光敏器件结合,通过监视器可以 方便观察被测管道内壁细小的裂痕、破损以及死 角等.

1 梯度折射率透镜的特性

梯度折射率透镜具有大小端数值孔径可变、结构紧凑和像质好的优点,用它作为内窥镜的物镜可进一步简化结构和提高像质^[11-12].梯度折射率透镜介质的折射率是非均匀的、按某种规律变化的.因此,光线传播轨迹不是直线,而是曲线.

设计中采用径向梯度折射率透镜.其折射率是 径向距离的函数,等折射率面为中心轴对称的圆柱 面系,介质中折射率变化的梯度是常量.

梯度折射率材料折射率剖面的函数一般表达式 为^[13-14]

$$n^{2}(r) = n^{2}(0) [1 - (ar)^{2} + h_{4}(ar)^{4} + h_{6}(ar)^{6} + \dots + h_{i}(ar)^{i}]$$
(1)

式中:r为垂轴距离, $r = (x^2 + y^2)^{1/2}$;a为折射率梯 度分布常量; h_i 为介质次项分布系数.

在径向梯度折射率介质 $n^2 = n^2(0) [1 - a^2(x^2 + y^2)]$ 中,光线轨迹在子午面内是一条正弦曲线,其周 期为 $(2\pi/a)\cos \zeta$,曲线的振幅、周期均与 a 成反比, 且随光线初始入射 ζ_0 (与光轴 z 的夹角)变化,这表 明该介质对不同入射角的光线具有不同的会聚能 力.该介质的聚焦周期为 $2\pi/a$,表明这种介质中某 一轴上点所发出的近轴光线会周期性的在轴上重新 聚焦,此聚焦点为原轴上点的理想像点.实际光线与 近轴光线轨迹如图 1.

Tel:0431-85318844
 Email:great-peak-love@163.com

 收稿日期:2010-05-24
 修回日期:2010-07-08



Fig. 1 Beam propagation path

梯度折射率透镜内的光传播正弦曲线特性使其 获得很大的景深,且其景深随物距的减小而增大,不 遵守几何光学中几何景深公式.因此,在对内窥镜的 显微系统设计时,可使梯度折射率透镜的与显微镜 结合,扩大内窥镜的景深,满足内窥镜光学系统大景 深的设计要求.

2 内窥镜光学系统设计

本文根据管道内窥镜大放大倍率、大景深的实际使用需求,设计了将梯度折射率透镜与内窥镜中显微镜相结合的光学系统,在保证放大倍率的同时, 有效提高内窥镜的光学系统景深.具体技术指标为: 1)物方视场大于 2y=6 mm;2)景深大于 1 mm;3) 用 CCD 1/2"接收,像素尺寸 10 μm.

管道内窥镜如图 2. 检测被测管道时,被照明的 检测表面先经径向梯度折射率透镜成像,经反射镜 转向后,再用显微物镜将其放大,最后通过场镜和转 像透镜成像并由 CCD 接收,最终通过监视器观察检 测结果.



图 2 管道内窥镜结构 Fig. 2 Layout of the pipeline endoscope

3 设计过程

3.1 4倍显微物镜设计

管道内窥镜主要是针对工业管道的表面裂纹、 毛刺及腐蚀及粘附杂物等异常现象进行诊断,不需 要太高的分辨率.因此,4倍显微物镜即可满足使用 要求.

设计的四倍显微物镜技术指标为:焦距,f = 36.2 mm;线视场,2y = 6.2 mm;数值孔径,NA = 0.1.

应用 ZEMAX 软件对其设计可得:其结构如图 3;由其调制传递函数(图 4)可知,该显微物镜的调 制传递函数曲线基本与衍射极限曲线重合;三个视 场的点列图(图 5)均方根半径分别为 3.721 μm、 3.410 μm、3.291 μm,均小于艾里斑的半径 7.068 μm; 最大波像差(图6)都小于 0.25λ;另外,显微物镜的 几何景深为 0.018 mm.





Fig. 6 Wavefront aberration of microlens

3.2 梯度折射率透镜设计

梯度折射率透镜介质的折射率是按某种规律变化的.正是由于该特性,将其与显微物镜相结合可以 有效增加光学系统的成像景深.在用 ZEMAX 设计时,选用梯度折射率表面 Gradient 9,其表达式为

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k)c^2r^2}} + x \tan \alpha + x \tan \beta \quad (2)$$

式中:c 是表面曲率(半径的倒数),r 是半径坐标,k是锥形常量, $\tan \alpha$ 和 $\tan \beta \in X$ 和 Y 轴上倾斜角的 正切.梯度折射率表面 Gradient 9 梯度折射率函 数为

$$n = n_0 [1, 0 - (A/2)r^2]$$
 (3)

式中,A、n。分别与λ的函数关系为

$$A(\lambda) = [K_0 + K_1/\lambda^2 + K_2/\lambda^4]^2$$
(4)

$$n_0 = B + C/\lambda^2 \tag{5}$$

式中,B、C、 k_0 、 k_1 及 k_2 均为常量.

所设计的梯度折射率透镜如图 7,其长度为 3 mm,周期长度为 5.893 mm,NA 为 0.033,以使 其像方数值孔径与显微物镜的物方数值孔径相匹 配.采用波长为 585 nm、光源的光谱效率值为 11 m/W的 GaAS_{0.15} P_{0.85},N单色光.由调制传递函 数(图 8)可知,在截止频率为 50 lp/mm 时,其调制 传递函数曲线基本与衍射极限曲线重合.0视场的 点列图(图9)均方根半径小于艾里斑的半径 77.72 μm,





满足设计需求.

3.3 转向透镜与场镜设计

为满足系统结构长度要求,需设计一个放大倍 率为转向透镜,设计结构如图 10.



图 10 转像透镜结构图 Fig. 10 Layout of the relay lens

为了解决经显微物镜后的成像光束口径过大, 无法与转向透镜匹配的问题,需在显微物镜后的实 像面处加入一个场镜.由于该场镜是加在实像面处, 因此,它对显微系统的光学特性无影响,也不改变轴 上点的光束走向.

3.4 总体优化

最后,将设计完成的梯度折射率透镜、四倍显微 物镜、转像透镜、场镜及反射镜进行总体优化设计, 使内窥镜中各个部分的参量相匹配,以满足其使用 要求.

在 ZEMAX 中输入各参量,选择适当的优化函数,进行优化设计.最后,将完成优化的数据进行规划,得到最终的设计结果.

图 11 是内窥镜系统分别在 0、0.5、0.7 和 1 视 场的点列图和调制传递函数曲线图.由图可知,各个 视场的弥散斑大小均小于艾里斑半径 77.18 μm.且 在截至频率为50 lp/mm时,各视场的调制传递函数 曲线均与衍射极限重合或接近,截止频率为 50 lp/ mm,满足使用要求.最后,分别取各个视场的最佳 像点,绘制其像距与垂轴距离的曲线图,如图 12.可 知,该系统所有视场的最佳像点形成一条近似球面 的曲线,可应用测试的最佳表面为球面.因此,该系 统可以方便的应用于工业管道内球形表面的测试.



图 13 各视场的像点位置曲线 Fig. 13 Image point position of each field of view

3.5 数据分析

经分析和计算,显微物镜的几何景深为 0.018 mm

Image position/mm

由拉赫不变量 *J* = *n*'*u*'*y*'可知,当*u*'减小时,*y*' 增大,表明系统所成的像增大,但其分辨率降低.由 ZEMAX 计算表明,若显微物镜的数值孔径变为 0.01,即分辨率约为原来的 1/10,其实际分辨率为 σ=λ/2NA=0.000 55/(2×0.01)=0.027 mm (6)
 由式(6)计算结果可知,尽管该系统的分辨率被

降低,但仍然能满足管道内窥镜的测试要求.设计后 的实际放大倍率 y'/y=3.1/2.8=1.1,线视场由 0. 78 增加至 2.83,即增大了 3.6 倍.

4 结论

将梯度折射率透镜用于管道内窥镜光学系统的 设计,利用其介质折射率渐变的特点,与显微镜物镜 相结合,在保证所需放大倍率的同时,使系统的几何 景深和物理景深均增大为原来的100倍.由其结构 图、点列图和MTF图可知,该系统拥有像质好、结 构简单.与同类内窥镜相比,该系统不仅有更大的景 深,而且像面近似球面,更适合圆柱形管道内壁的观 察.微调梯度透镜的位置,可进一步增加景深,例如, 如果梯度折射率透镜物距调节到0.1 mm时,该系 统的几何景深可增大约40 mm.计算表明,该系统 可测直径为10~45 mm的管道.当它与CCD等器 件相结合,不仅实现管道内窥镜的数字化,而且能通 过监视器在更大景深范围内、方便的监测管道内壁 的裂痕、磨损等清晰的图像.

参考文献

- [1] CHENG Wei-ming, LI Guo-dong. In-pipe video detector for small pipes[J]. Optics and Precision Engineering, 2001, 9 (6): 519-522.
 程维明,李国栋.用于细小工业管道的视频探测器[J]. 光学精 密工程,2001,9(6):519-522.
- [2] HENG Shi-quan. The application of industrial endoscope in power plant overhaul [J]. *Electronic Instrumentation Customer*, 2008, 5(15): 117-118. 横世权.工业内窥镜在某电厂大修中的应用[J]. 仪器仪表用 户,2008,5(15):117-118.
- [3] MO Xu-tao, LIU Wen-yao, WANG Jin-jiang. Key techniques for extending the depth of field of optical imaging system[J].

Opto-Electronic Engineering,2007,**12**(34):129-133. 莫绪涛,刘文耀,王晋疆.大景深光学成像系统关键技术的研究 [J].光电工程,2007,**12**(34):129-133.

- [4] WANG Qing-ying. Deduction on the formula of depth of field
 [J]. Journal of Nanyang Teachers'College (Natural Sciences Edition), 2003, 3(2): 24-26.
 王清英.景深公式的推导[J].南阳师范学院学报(自然科学版),2003,3(2):24-26.
- [5] HU Jin-min, XIE Shuang-wei. The depth of field of optical system[J]. *Physics Journal*, 2006(3): 59-60.
 胡金敏,谢双维.光学系统的景深[J].物理通报,2006(3): 59-60.
- [6] 郁道银,谈恒英.工程光学[M].北京:机械工业出版社,2006: 58-63.
- [7] XIA Chun-lei, ZHENG Gang, DAI Shu-guang. Large depth of field imaging technology & its phase shift control[J]. Laser Technology, 2008, 32(2): 159-162.
 夏春蕾,郑刚,戴曙光. 大景深成像技术及其相移现象的控制[J]. 激光技术, 2008, 32(2): 159-162.
- [8] WELFORD W T. Use of annular apertures to increase focal depth[J]. JOSA A, 1960, **50**(8):749-753.
- [9] FERRARO P, GRILLI S, ALFIERI D. Extended focused image in microscopy by digital holography[J]. Opt Express, 2005, 13(18): 6738-6749.
- [10] GEORGE N, CHI W. Extended depth of field using a logarithmic asphere[J]. J of Opt A: Pure and Appl Opt, 2003, 5(5): S157-S163.
- [11] TENTORI D, CAMACHO J, MARQUEZ H. Birefringence characterization of quarter-pitch gradient index lenses[J]. Soc of Photo-Opt Instrument Eng., 2002, 41(10): 2468-2475.
- [12] SHAO Rui, CHEN Li. The development of GRIN optics[J]. Chaohu College Journal, 2006, 2(8): 59-61. 邵瑞,陈力. 梯度折射率光学的发展现状[J]. 巢湖学院学报, 2006,2(8):59-61.
- [13] LI Yu-lin, HUO Jun-min, HE Zheng-quan. The development and application of gradient index Lens[J]. Acta Photonica Sinica, 2000, 12(29): 302-206.
 李育林,霍军民,贺正权.梯度折射率透镜的开发及应用[J]. 光子学报,2000,12(29):302-206.
- [14] 刘德森.纤维光学[M].北京:科学出版社,1987.

Design of Pipeline Endoscope Based on Gradient Index Lens

GUO Jun, MA Yong-li, ZHANG Lu, ZHAO Cui-ling, WANG Wen-sheng

(Laboratory of Contemporary Optical Measure Technology, Changchun University of Science and Technology,

Changchun 130022, China)

Abstract: According to the test requirements of the inner wall of a pipeline, an optical system of pipeline endoscope is designed, which is based on particular optical feature of gradient index lens and microscope. The system has the advantage of large depth of field. In the condition of required magnification, the depth of field of the system is increased by 200 than the initial system, which is achieved by the radial gradient in the reflective index of gradient index lens. The system is more suitable for pipeline internal surface inspection based on the feature of the nearly spherical surface of image plane. Combined with CCD, the digitalization test of pipeline endoscope is realized. Clear image of the defects in the inner wall of a pipeline, such as the crack and abrasions, can be checked conveniently by monitor in a larger extant of depth of field.

Key words: Endoscope; Gradient index lens(GRIN); Microscope; Large depth of field



GUO Jun was born in 1984. Now he is a M. S. degree candidate and his research interests focus on digital holographic interferometry and optical system design.



WANG Wen-sheng was born in 1944. As a professor and Doctoral Supervisor, he is engaged in the research on contemporary optical measure technology and optical design.